

# 膜厚測定器

レーザー光線を光源に使用した光透過型の非接触膜厚測定器です。レーザー光を絞ることにより、10ミクロンオーダーのごく小さい部分の膜厚を測定することもできます。

光が測定物を透過したときの減衰(吸収)量から厚さを求めるので、光を全く透過しないものは測定できません。

磁気テープの磁気膜の厚さ、アルミシートのアルミ膜の厚さ測定等に使用されています。放射線を用いた方法に比べ、きわめて廉価で使い勝手も簡便です。

## 用途

- ・ アルミ蒸着フィルム製造ラインでの膜厚測定。
- ・ 光が透過するフィルム等の製造ラインでの膜厚測定。

## 仕様例

- ・ 測定物 : 透明フィルムに蒸着されたアルミ膜
- ・ 測定範囲: 400 ~ 800 Å (ベースが透明フィルムの場合)
- ・ 光源 : 半導体レーザー
- ・ 表示 : デジタル3桁
- ・ 使用場所: 真空蒸着装置内

## 構成

- ・ 送光部 1台
- ・ 受光部 1台
- ・ 表示部 1台
- ・ 接続ケーブル 1式

上記の仕様は一例です。仕様はお打ち合わせの上、決めさせていただきます。